



適用規格					
定 格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃ (注1)	保存温度範囲		-10℃～ +60℃ (注3)
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲		40% ～ 70% (注3)
	適合コネクタ	DF57H-3S-1.2C(##)	UL・C-UL 定格 	使用温度範囲	-35℃～ +75℃ (注1)
	適合端子	DF57-****SCF(##)		電 圧	AC/DC 29V
	電 圧	AC/DC 50V	電 流	AWG28 : 2.0A/pin AWG30 : 1.5A/pin AWG32 : 1.0A/pin AWG34 : 0.8A/pin	AWG28 : 2.0A/pin AWG30 : 1.5A/pin AWG32 : 1.2A/pin AWG34 : 1.0A/pin

性 能

	試験方法	規 格	QT	AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	
	表示	目視にて確認する。	○	○
電 氣 的 性 能	低電圧, 低電流下の接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	○	—
	耐電圧	AC 500 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 20.0 N以下 引抜力 0.9 N以上	
	耐振性	周波数 10~55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃, 湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1~2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 100 MΩ 以上 ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2~3分 (室温に1~2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 100 MΩ 以上 ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	
	はんだ耐熱性	【リフローはんだ付けの場合】 以下の温度条件で2回のリフローを行う。 リフロー部: ピーク温度250℃ 10秒以内 220℃以上 60秒以下 予熱部: 150~180℃ 90~120秒 【手はんだの場合】 はんだごて温度 350±10℃, 3秒の条件にてはんだ付けを行う。 但し, 端子に力は加えないこと。	外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。	
	はんだ付け性	はんだ温度 245 °C, 浸せき時間 5 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだでぬれていること。	



備考

- (注1) 通電時の温度上昇を含む。
- (注2) 結露のないこと。
- (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。
基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。

△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
 1	DIS-H-00005763	HK. HAYASHI	SZ. ONO	20200220

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。	承認	KI. AKIYAMA	20120522
	検 図	HK. UMEHARA	20120521
	担 当	TS. KUMAZAWA	20120521
	製 図	MI. SAKIMURA	20120518

注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目 図番 SLC-343905-21-01

	製品規格表	製品名	DF57H-3P-1.2V(21)	
	ヒロセ電機株式会社	製品コード	CL666-0105-0-21	 1/1